

---

---

**Analyse chimique des surfaces —  
Spectrométrie de masse des ions  
secondaires — Méthode pour  
l'étalonnage de la profondeur pour  
le silicium à l'aide de matériaux de  
référence à couches delta multiples**

*Surface chemical analysis — Secondary-ion mass spectrometry —  
Method for depth calibration for silicon using multiple delta-layer  
reference materials*



**Pour plus d'infos, merci de nous contacter.**

**Association Sénégalaise de Normalisation**

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage  
Dakar - SENEGAL

**Tel: +221 33 829 58 25**

**Email: [asn@asn.sn](mailto:asn@asn.sn)**